

■ 연구과제 요약문4

과제명(기간)	(삼성전자(주)_3차년도)기계 학습을 활용한 데이터 기반 진단, 고장 예지 및 내구성 평가 기술 연구(2017-07-01~2018-06-30)
연구책임자	조 성 준 (zoon@snu.ac.kr)
개요	Variational Auto encoder Neural Network을 활용한 반도체 공정의 불량 웨이퍼 혐의 공정 및 파라미터 식별
연구개발 결과	Variational Autoencoder 신경망 개발
활용분야 및 기대효과	소수의 데이터 환경에서 혐의 공정 파악에 도움이 됨